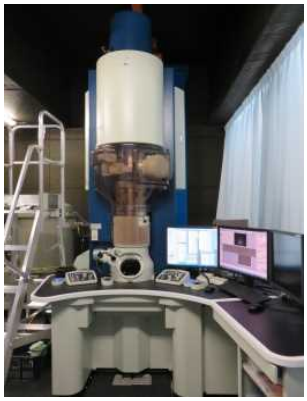
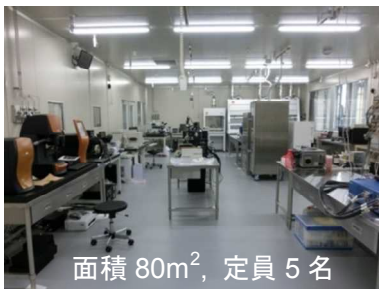
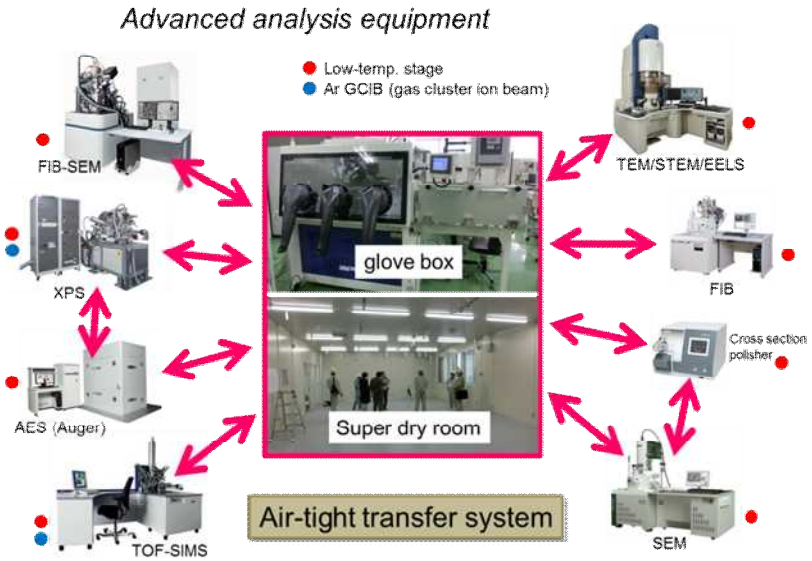
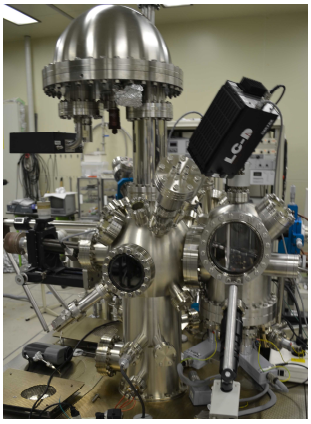
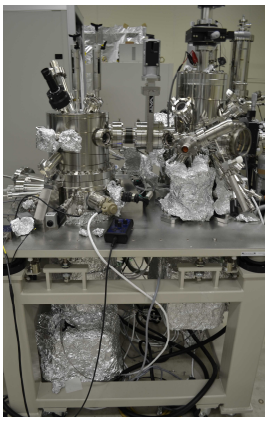
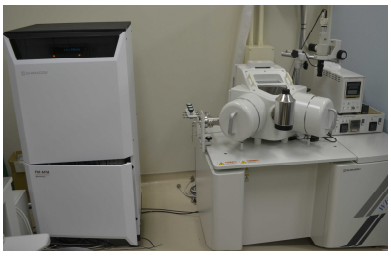
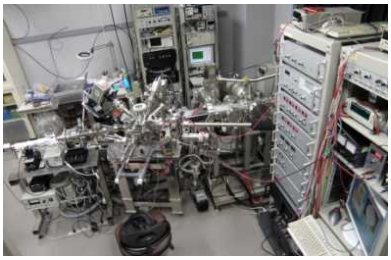
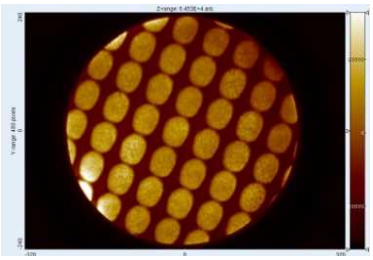
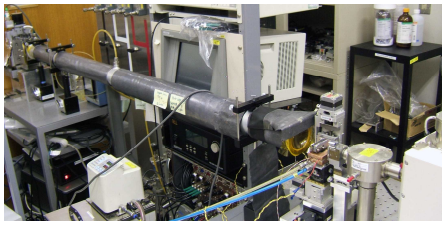
1. 研究者	三石和貴、竹口雅樹
2. 研究者 DB 等	http://researchmap.jp/read0005913/ http://researchmap.jp/read0208633/
3. 所属	中核機能部門／電子顕微鏡ステーション
4. 研究テーマ	a)最先端電子顕微鏡による高度電顕手法利用材料研究 b)最先端電子顕微鏡群による多手法統合による材料研究 c)最先端電子顕微鏡を用いた新規電顕手法開発
5. 利用可能な施設・装置等	【主な分析装置】  実動環境対応ホログラフィー電子顕微鏡（JEM-ARM200F-Cold）（写真左上）） 実動環境対応物理分析電子顕微鏡（JEM-ARM200F）（写真右上） 走査型電子顕微鏡（JSM-7000F）　FIB 加工装置（JIB-4000）
6. 研究室等 HP	http://home.nims.go.jp/tem/
7. E-MAIL	tem@nims.go.jp
8. TEL	029-859-2670
9. 特記事項	電子顕微鏡の収束系と結像系それぞれに収差補正装置を備えた電子顕微鏡による高分解能観察。最新の EELS、EDS による分析。様々な特殊試料ホルダーによるその場実験。

1. 研究者	久保 佳実
2. 研究者 DB 等	http://samurai.nims.go.jp/KUBO_Yoshimi-j.html
3. 所属	ナノ材料科学環境拠点（GREEN）／蓄電池基盤プラットフォーム
4. 研究テーマ	リチウム空気二次電池／次世代蓄電池評価解析
5. 利用可能な施設・装置等	【スーパードライルーム】蓄電池の研究開発に不可欠な超乾燥空気（水分量 0.1 ppm 以下）を供給。電池試作や特性評価を自由に行なうことができる。  試作したラミネート型リチウム空気電池 【主な分析評価装置】大型設備としては、TEM, SEM, FIB-SEM, TOF-SIMS, XPS, HAXPES, AES, SPM, XRD, LC/MS, GC/MS, ICP/MS など最先端の各種評価装置群を取り揃えている。また、試料の多くがリチウムを含有するため、大気非曝露下での試料搬送や低ダメージ化が必須要件であり、そのための特殊なアタッチメント類を整備している。 
6. 研究室等 HP	http://www.nims.go.jp/GREEN/research/lithiumairbattery.html http://www.nims.go.jp/brp/nims/
7. E-MAIL	KUBO.Yoshimi@nims.go.jp
8. TEL	029-860-4773
9. 特記事項	本研究は、文部科学省委託事業「ナノ材料科学環境拠点」（GREEN）、および ALCA 特別重点技術領域「次世代蓄電池」の支援を受けて行われている。

1. 研究者	藤田大介、大西桂子、山内泰
2. 研究者 DB 等	http://samurai.nims.go.jp/FUJITA_Daisuke-j.html http://samurai.nims.go.jp/ONISHI_Keiko-j.html http://samurai.nims.go.jp/YAMAUCHI_Yasushi-j.html
3. 所属	先端的共通技術部門／極限計測ユニット
4. 研究テーマ	a)最先端走査型プローブ顕微鏡による高度な表面ナノ物性計測 b)走査型ヘリウムイオン顕微鏡によるナノ計測とナノ創製加工 c) ナノ計測装置群を用いた表面解析による次世代材料開発
5. 利用可能な施設・装置等	【主なサブナノスケール計測イメージング装置】  超高真空低温 STM  超高真空光照射場 SPM  周波数変調 SPM 走査型ヘリウムイオン顕微鏡  PEEM/SP-MEEM  PEEM 像 【主なナノ計測装置】PEEM/SP-MEEM（光電子放出電子顕微鏡／スピン偏極－放出電子顕微鏡）装置
6. 研究室等 HP	http://www.nims.go.jp/units/u_neplus-compute/index.html http://www.nims.go.jp/spin/
7. E-MAIL	Fujita.daisuke@nims.go.jp, Onishi.keiko@nims.go.jp, Yamauchi.yasushi@nims.go.jp
8. TEL	029-859-2741（藤田）、2740（大西）、2826（山内）
9. 特記事項	・超高真空低温走査型トンネル顕微鏡（UHV-LT-STM）による原子分解能での表面電子状態イメージング ・超高真空低温光照射場走査型プローブ顕微鏡（UHV-LT-SPM）による原子分解能での表面原子構造・物性イメージング ・走査型ヘリウムイオン顕微鏡による高分解能ナノイメージング、ナノスケールリソグラフィーとビーム誘起ガス分解ナノ構造の創製 ・Hg 紫外線照射下の PEEM 像観察ならびにスピン偏極準安定 He 原子線照射下の SP-MEEM 像観察によるスピントロニクス材料をはじめとする先進材料開発を推進。

1. 研究者	北澤英明、桜井健次、間宮広明
2. 研究者 DB 等	http://samurai.nims.go.jp/KITAZAWA_Hideaki-j.html（北澤） http://samurai.nims.go.jp/SAKURAI_Kenji-j.html(桜井) http://samurai.nims.go.jp/MAMIYA_Hiroaki-j.html（間宮）
3. 所属	先端的共通技術部門／量子ビームユニット
4. 研究テーマ	量子ビーム(X 線・中性子)を活用した機能材料・構造材料研究
5. 利用可能な施設・装置等	 赤外線イメージ炉 多元スパッタ装置 【主な試料作成装置】単アーク炉、テトラアーク炉、赤外線イメージ炉、Wメッシュヒーター炉、高周波誘導加熱炉、多元スパッタ装置他 X 線小角散乱装置  X 線反射率計 【主な分析装置】X線粉末装置、単結晶 4 軸回折装置、小角散乱装置、X 線反射率計、TOF-SIMS 装置、SEM-EDS 装置、多目的物性測定装置(PPMS)、磁化測定装置(MPMS)、熱分析装置他
6. 研究室等 HP	http://www.nims.go.jp/units/u_quantum-beam/index.html
7. E-MAIL	KITAZAWA.Hideaki@nims.go.jp, SAKURAI.Kenji@nims.go.jp, MAMIYA.Hiroaki@nims.go.jp
8. TEL	029-859-2818(北澤)、2821(桜井)、2755(間宮)
9. 特記事項	・各種単結晶育成装置による大型単結晶育成 ・RIETAN-FP による電子密度・原子核密度可視化 ・小角から広角にかけての X線回折によるマルチスケール構造解析 ・薄膜・多層膜の埋もれた界面の X 線による構造解析 ・PPMS 及び MPMS による各種物性測定